

信頼性試験結果
Reliability Test

XC6602シリーズ

XC6602 Series

パッケージ
Package

WLP-5-02

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=3.3V VBIAS=6.3V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
3	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=3.3V VBIAS=6.3V	1000	0/22
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-65°C~150°C 各30分 30min Each	100CYC.	0/22
5	プレッシャークッカー UHAST	125°C85%RH 2×10 ⁵ Pa	100	0/22
6	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times →85°C85%RH24h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)1time Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020		0/22
7	静電耐圧 Electric Static Discharge	R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回 R=0Ω C=200pF ±200V over 3times Each R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回 R=1500Ω C=100pF ±1kV over 3times Each		0/20
8	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 R=0Ω C=200pF ±100V over 3times Each 50mA以上 50mA over		0/5